物理学报 Acta Physica Sinica





100-keV质子在聚碳酸酯微孔膜中传输的动态演化过程

周旺 牛书通 闫学文 白雄飞 韩承志 张鹛枭 周利华 杨爱香 潘鹏 邵剑雄 陈熙萌

Dynamic evolution of 100-keV H⁺ through polycarbonate nanocapillaries Zhou Wang Niu Shu-Tong Yan Xue-Wen Bai Xiong-Fei Han Cheng-Zhi Zhang Mei-Xiao Zhou Li-Hua Yang Ai-Xiang Pan Peng Shao Jian-Xiong Chen Xi-Meng

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 65, 103401 (2016) DOI: 10.7498/aps.65.103401 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.103401 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2016/V65/I10

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

近玻尔速度氙离子激发钒的K壳层X射线

Vanadium K-shell X-ray emission induced by xenon ions at near the Bohr velocity 物理学报.2016, 65(2): 027901 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.027901

Mg-CO($X^1\Sigma^+$)体系的冷碰撞动力学

Collision dynamic behaviors of CO(X¹ Σ^+) molecule with Mg atom in cold and ultracold temperatures 物理学报.2015, 64(10): 103402 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.103402

低能氢粒子沿不同角度轰击钨(001)表面的反射概率及入射深度分布的分子动力学研究

Molecular dynamics simulation of low-energy hydrogen atoms bombarding tungsten (001) surface at different angles and their depth distribution 物理学报.2013, 62(22): 227901 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.227901

近玻尔速度 Ne²⁺ 离子穿过碳膜引起的电子发射

Secondary electron emission from carbon Foils by Ne²⁺ near Bohr velocity 物理学报.2013, 62(15): 157901 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.157901

100-keV质子在聚碳酸酯微孔膜中传输的 动态演化过程*

周旺 牛书通 闫学文 白雄飞 韩承志 张鹛枭 周利华 杨爱香 潘鹏 邵剑雄[†] 陈熙萌[‡]

(兰州大学核科学与技术学院, 兰州 730000)

(2016年1月17日收到;2016年3月7日收到修改稿)

本工作测量了 100 keV 质子穿过倾角为+1° 的聚碳酸酯 (PC) 纳米微孔膜后, 出射粒子电荷态、位置的分 布以及相对穿透率随时间的演化. 实验发现, 100 keV(*E*/q约为 100 kV) 质子穿过绝缘纳米微孔的物理机理与 keV 能区的导向过程有根本的不同. 在实验测量初期, 微孔内部无电荷沉积, 质子主要通过在微孔内表面以下 的多次随机二体碰撞过程为主要传输机理; 而当充放电平衡后, 微孔内部有明显的电荷斑, 主要传输机理为电 荷斑辅助的表面以上 (或近表面) 的镜面散射行为. 这一物理图像使质子穿过微孔的物理认识更加深入和完整, 也将促进百千电子伏质子微束的应用.

关键词: 微孔膜, 电荷斑, 表面散射 PACS: 34.50.-s, 79.20.Rf, 68.49.Sf

DOI: 10.7498/aps.65.103401

1引言

随着纳米技术的发展,纳米尺寸的微管在物理、生物^[1-3]和材料^[4]等领域得到了广泛的应用. 对不同材料的纳米微管的电特性研究显得越来越 重要. 探索带电离子在纳米微管中的输运^[5]是一 种对纳米微管电特性研究的很好手段,同时对微束 的控制与应用^[6,7]也是十分有价值的.

Stolterfoht等^[5]发现的"导向效应"显示,低能 高电荷态离子能够在与微孔膜的倾角大于微孔几 何张角的情况下,保持初始电荷态并沿着孔轴方向 (微孔轴线方向)穿过微孔,而不会与微孔内壁发生 近距离碰撞.此后的研究表明^[8–13],在微孔内壁随 着时间演化逐个形成的自组织电荷斑对导向效应 起决定性作用.尽管电子和负离子穿过绝缘微孔的 机理和正离子不同,但是也都观测到了表观上的导 向现象^[14–17]. 在中间能区 (100 keV), 离子穿过纳米微孔的 输运机理是一个未被充分研究的重要问题. 在应 用方面,百千电子伏的离子正好处在布拉格峰附近, 其在物质中射程一般在微米量级且在物质表面沉 积能量较大,这使得百千电子伏离子微束在单细胞 辐照领域有很好的应用前景. 因此,该能区离子在 纳米微孔中的输运机理需要深入地研究.

在本工作中,我们测量了100 keV质子穿过倾 斜角为+1°的PC纳米微孔膜后,出射粒子的出射 角(出射粒子与入射离子间的夹角)分布、电荷态分 布以及相对穿透率随时间的演化.实验结果表明: 在充放电平衡后,出射粒子角分布逐渐转向入射束

另一方面, MeV 能区的离子在微孔中的输运行 为也得到了研究^[18].研究结果表明:微孔内壁沉 积的电荷对 MeV 离子穿过微孔没有影响, 而深入 表面以下的多次随机的非弹性碰撞是主要输运机 理.基于二体卢瑟福散射的蒙特卡洛计算可以较好 地描述该能区离子穿过微孔的传输特性.

^{*} 国家自然科学基金(批准号: 11174116, 11175075)资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: shaojx@lzu.edu.cn

[‡]通信作者. E-mail: chenxm@lzu.edu.cn

^{© 2016} 中国物理学会 Chinese Physical Society

流方向附近,而不在导向方向.同时,我们利用理 论计算针对这一特性给出定量的解释.

2 实验方法

本实验在中国科学院近代物理研究所320 kV 高电荷态离子物理实验平台完成.实验装置如 图1所示.

320 kV高电荷态离子综合研究平台使用 14.5 GHz ECR离子源. 束流密度为1 nA/mm²的 质子束经过两块相距75 cm, 孔径为1.5 mm×1.5 mm光栏准直后(发散度为0.2°), 与高真空靶室中 央的PC微孔膜碰撞, 靶室真空度为10⁻⁶ Pa. 在实 验中, 微孔膜的倾斜角 ϕ (入射束流与微孔膜法向量 之间的夹角)通过精度为0.1°的调角器来实现, 微 孔膜的俯仰角通过位于靶室前端距离微孔膜10 cm 处的一对静电偏转板来调节, 保证束流在竖直方向 上以90°垂直入射微孔膜. 靶室后端的偏转板距靶 7 cm 处, 通过调节后偏转板上所加高压使得出射粒 子中的H⁺离子和H原子在y轴方向得以分离并且 保留了其在x轴方向的信息.出射粒子的位置分布 信息被距离靶架后方30 cm处的二维微通道板探 测器记录.图1(c)所示的是最终形成的图像,其中 上束斑为H⁺离子,下束斑为H原子,可以看到H⁺ 与H⁰得到了有效分离,并且本底计数较低.

本实验所采用的PC绝缘微孔膜制备过程是先 经过德国GSI的11.4 MeV/u铀离子辐照,然后在 5 M (1 M = 1 mol/L), 50 °C 的氢氧化钠溶液中 蚀刻,使重离子径迹在PC膜中形成微孔. 微孔的 直径为200 nm,厚度为30 µm,其深宽比为150:1, 对应的几何张角为0.38°.图1(b)所示的是该微孔 膜的扫描电子显微成像,从图中可以看到微孔之间 分离较大且没有发生重叠现象.从由此制作的纳米 线可以看出微孔为规则的圆柱体^[19],孔径一致且 内表面比较光滑.为了避免在实验过程中发生的表 面充电效应,在微孔膜前后平面都进行了以45°方 向镀有30 nm厚的金层.



图1 (网刊彩色) 实验装置示意图 (a) 对束流方向(B)和导向方向(G)的定义;(b) PC 绝缘微孔膜的扫描电子显微镜成像;(c) 100 keV H⁺ 离子以 +1°倾斜角入射微孔膜后所呈现的典型二维谱图

Fig. 1. (color online) Schematic diagram of the experiment: (a) Definitions of the beam direction (B) and guiding direction (G); (b) SEM image of the PC nanocapillary membrane; (c) the typical 2D spectrum of transmitted particles with 100 keV incident energy and with a tilt angle of $+1^{\circ}$.

3 实验结果

图 2 给出了 100 keV 质子以 +1° 倾斜角入射 PC 绝缘微孔膜后出射粒子投影谱形的时间演化. 从图 2 可以看出,在实验刚开始阶段 H⁺和 H⁰的出 射角方位都分布在 +1° 方向,也就是微孔的轴向 方向 (G),并且出射粒子位置分布呈现较好的高斯 型分布.随着沉积电荷的增加,见图2(b),出射的 H⁺和H⁰粒子逐渐趋向0°方向,也就是质子的入 射方向(B).当微孔内部沉积电荷达到一定量时, 见图2(c),出射的H⁺离子在大约-0.2°附近开始 出现了一个小峰,出射质子呈现双峰叠加的行为. 达到充放电平衡后,从图2(d)可以看到H⁺离子在 -0.2°附近的峰逐渐明显,顺着入射方向出射H⁺



图 2 (网刊彩色) 出射粒子位置谱在 x 方向的投影随测量时间的演化 (a)—(d) 分别为微孔膜前表面接收电荷为 5×10^5 , 2×10^7 , 4×10^7 和 7×10^7 pC时的投影谱图. 黑色实线代表总的出射粒子, 蓝色和红色实线分别表示出 射的 H⁺ 和 H⁰

Fig. 2. (color online) The time evolution of the transmitted particles projected in x direction: (a)–(d) present the charge deposited on the front surface of 5×10^5 , 2×10^7 , 4×10^7 and 7×10^7 pC; the black, blue and red solid lines present the total transmitted particles, H⁺ and H⁰, respectively.

离子相对比例明显增强, H⁰在出射粒子中所占的 份额明显减少.为了进一步阐述100 keV质子穿过 微孔膜后出射粒子特性随时间演化的过程,我们在 图3—图6中详细给出出射粒子的中心角度、半高 宽(FWHM)、电荷态分布以及相对穿透率随时间演 化特性图.



图3 (网刊彩色) 100 keV 质子以 +1° 倾斜角入射 PC 绝 缘微孔膜后出射粒子中心角随时间的演化,其中黑色实心 方形表示出射的 H⁺ 离子,红色空心圆形表示出射的 H⁰ 原子

Fig. 3. (color online) Evolution of the centroid angle of transmitted particles at an incident energy of 100 keV and a membrane tilt angle of $+1^{\circ}$. The black solid square and red open circle present the transmitted H⁺ and H⁰, respectively.

100 keV质子以+1°倾斜角入射PC绝缘微孔 膜后出射粒子中心角的时间演化如图3所示,图中 横坐标是从微孔膜前表面接收到的入射质子所带 的总电荷量.在测量刚开始阶段,H⁺和H⁰的出射 中心角位于+0.9°方向,粒子基本上是沿着微孔轴 线方向出射.随着充电过程的进行,出射粒子的中 心角均偏0°方向附近.当达到充放电平衡后,H⁺ 和 H⁰ 的出射中心角分别稳定在 –0.1° 和 0.1° 附近, 即出射粒子大部分沿着质子入射方向出射, 而不是 沿着微孔的导向方向.



图 4 100 keV 质子以 +1°倾斜角入射 PC 绝缘微孔膜后 出射粒子相对穿透率随时间的演化

Fig. 4. Evolution of the relative transmission rate of transmitted particles at an incident energy of 100 keV and a membrane tilt angle of $+1^{\circ}$.

图4所示为在测量过程中粒子相对穿透率随时间的演化过程.从图4可以看出,随着充电过程的进行,粒子的相对穿透率在实验开始阶段由大约30%上升至最大值,随后随着测量时间的增加有微弱并且缓慢的减弱.该减弱过程是由于微孔内部积累电荷过多所导致的Blocking效应^[20]所致,微孔入口处过强的电荷斑将会适度减弱离子进入微孔的概率,并且过度扭曲离子的轨迹减弱其出射率. 在微孔内部达到充放电平衡后,其相对穿透率达到最大穿透率的大约70%—80%之间.简而言之,对于100 keV的入射质子,微孔内部所沉积的电荷仍然会对粒子的穿透率有较为明显的增强作用.



图5 (网刊彩色) 100 keV 质子以 +1° 倾斜角入射 PC 绝 缘微孔膜后出射粒子电荷态分布随时间的演化, 其中黑色 实心方形表示出射 H⁺ 相对份额, 红色空心圆形表示出射 H⁰ 的相对份额

Fig. 5. (color online) Evolution of the charge purity of transmitted particles at an incident energy of 100 keV and a membrane tilt angle of $+1^{\circ}$. The black solid square and red open circle present the transmitted H⁺ and H⁰, respectively.



图 6 (网刊彩色) 100 keV 质子以 +1°倾斜角入射 PC 绝缘微孔膜后出射粒子半高宽随时间的演化,其中黑色实心 方形表示 H⁺, 红色空心圆形表示 H⁰

Fig. 6. (color online) Evolution of the FWHM of transmitted particles at an incident energy of 100 keV and a membrane tilt angle of $+1^{\circ}$. The black solid square and red open circle present the transmitted H⁺ and H⁰, respectively.

图5给出在测量过程中出射粒子的电荷态分 布随时间的演化特性.从图5可以看出,在测量初 始阶段,出射粒子中质子的相对比例大约为50%左 右,该实验值和Bohr的离子在固体中穿行时的平 衡电荷态公式估算出的结果保持较好的一致性,一 定程度上说明在测量刚开始时,入射质子应当是经 过微孔内表面以下数次碰撞达到电荷平衡态后,从 微孔后端出射.随着充电过程的进行,出射粒子中 质子的份额从54%上升至70%左右,之后经过缓慢 上升在充放电平衡后,最终出射的H+的份额保持 在75%左右.从图5中可以明确看出,微孔内部沉 积的电荷有助于抑制入射质子和微孔内部进行的 电荷交换过程.

出射粒子半高宽随时间的演化如图 6 所示,在 测量初期,出射的 H⁺ 离子和 H⁰ 原子的半高宽基本 一致,均为1.2° 左右. 该现象说明在电荷斑尚未建 立时,质子和氢原子在微孔内部的传输机理基本一 致. 随着充电过程的进行,出射粒子中 H⁺和 H⁰的 半高宽都随着入射电荷量的增加而变大,逐渐从 1.2° 增大至 2.2° 左右. 之后,随着微孔内部充电量 的继续增加,出射 H⁰的半高宽保持小幅度增大,最 终稳定在 2.8°;而出射 H⁺的半高宽则开始逐渐变 小,最终稳定在 0.4° 左右,约等于微孔的几何张角, 该特性和 H⁰的演化特性相反.

4 讨 论

结合上述实验现象可以看出,100 keV质子以 +1°倾斜角入射PC 微孔膜,微孔内部沉积的电荷 斑对粒子的输运过程起到重要的影响.具体表现 在,随着充电过程的进行,出射粒子位置分布中心 角由实验开始阶段的微孔轴向方向逐步向入射束 流方向转变,最终在达到充放电平衡后保持在入射 束流方向附近,这一点与低能段的导向过程有很大 不同.另一方面,微孔内部不断增强的电荷斑能够 明显抑制入射质子在微孔内部的电荷交换过程,出 射粒子中 H⁺成分随着充电过程的进行不断增大. 同时,电荷斑的形成也有助于入射质子通过微孔 膜,达到充放电平衡后粒子的相对穿透率较测量初 期有显著的提升.在下文中,我们将对这些100 keV 质子传输的主要特性做出定性分析.

在以往研究低能(keV)区,离子和微孔膜相互 作用时,一般认为微孔内部电荷斑产生的导向力足 以抵消入射离子倾斜入射时的横向动量,从而让离 子顺着孔道方向平行出射,形成导向.

但是对于100 keV左右的离子,其在倾斜状态 下入射时横向动量要比低能的keV离子高一到两 个数量级,微孔内部电荷斑的库仑力很可能不能够 完全抵消入射离子的横向动量.在这种情况下,入 射离子就会有较大的机会去和微孔内壁发生近距 离的散射,而这种散射力和导向力的协同作用是百 千电子伏能区离子在微孔内部传输有别于低能离 子的最根本原因.

当粒子在微孔内部运行时基本上会受到三种力的作用.第一种是微孔内部沉积电荷斑对入射粒

子的长程库仑力,即导向力,该力倾向于抵消入射 粒子横向动量,使粒子沿孔道方向出射.第二种是 当粒子进入微孔内表面以下时,它与表面以下原子 的多次随机碰撞中所受到的二体碰撞力,这种力倾 向于使入射粒子忘记入射时轨迹、电荷等初始信息, 使粒子运动更加无规则.第三种是当入射粒子在表 面以上的近表面区域运动时,会感受到表面最上面 几层原子的短程集体散射力作用,这种力在表面以 上几个原子单位之内很强,倾向于使小角度入射并 接近表面的粒子呈现出"镜面掠射"的散射过程.

在测量初始阶段, 微孔内部没有明显的电荷沉 积,出射粒子中的质子和氢原子均按照微孔孔道方 向出射,位置分布呈现近高斯型,半高宽约为1.2° 明显大于微孔的几何张角0.38°;并且其电荷分布 符合Bohr的电荷平衡态公式计算的结果. 这些特 征说明, 测量初期几乎所有的入射质子均穿入微孔 内表面以下,在表面以下的多次随机碰撞后,入射 质子丢失了对于原始电荷态以及轨迹的记忆,其轨 迹变得很曲折也很不规则, 最终不得不沿着微孔 孔道方向出射. 这样的无规则出射过程将导致在 实验上观测到出射质子和氢原子均沿着微孔导向 方向出射,且基本为对称高斯型、半高宽较宽,电 荷分布满足平衡电荷公式. 简而言之, 测量初期, 100 keV 质子在微孔内部传输过程是表面以下的多 次随机二体碰撞过程,仅仅是"表观"上的导向过 程,和图2(a)中的实验观测结果一致.

随着充电过程的进行, 微孔内部电荷斑基本 建立, 但是其电荷斑强度仅可以适当减弱入射 100 keV质子的横向动能(约几十个eV), 但不能完 全抵消它.入射离子仍然有较大概率去接近表面, 甚至穿入表面以下.此时电荷斑仅仅是一种辅助作 用, 它可以排斥入射离子以适当增加入射离子在表 面以上的近表面区域内掠射通过的概率.此时, 最 上面几层的表面原子集体散射力起到至关重要的 影响, 在众多向上的集体散射力合力的作用下, 入 射离子将以近似的"小角度镜面反射"的方式出射. 当粒子运动到微孔的后半段时, 再经由一次电荷斑 辅助的表面集体散射作用下的镜面反射后, 大部分 的出射粒子将在两次镜面反射后按照入射离子方 向附近出射.

由于有相当一部分入射离子仍会穿入微孔内 表面以下,经过数次随机二体碰撞后沿着孔道方向 出射.所以,最终的出射粒子谱在*x*轴方向投影应 当由两部分组成.主要的一部分是经由电荷斑辅助 的两次镜面散射过程出射,呈现出在入射离子方向 (即B方向)的尖锐的出射峰;另一小部分仍然是经 由表面以下多次随机碰撞最终以小概率从微孔孔 道方向(G方向)出射的粒子.所以,其谱型应当是 零度左右较高的尖峰和一度左右较低的平缓高斯 峰的叠加,这一点和图2(d)的实验测量结果是相 符的.

由于电荷斑仍然起到增强表面以上掠射过程 概率的作用,所以可预期粒子的出射率应当会随着 电荷斑的增强而增强.另一方面,电荷斑起到抑制 粒子接近微孔内表面的作用,减少入射离子与表 面的电荷交换,出射粒子电荷态纯度也应当适当 提高.

对于出射粒子角分布的半高宽而言,在尚未达 到充放电平衡时,经由两次镜面散射后出射的粒子 仅会在大约0°(即B方向)方向产生一个较弱的镜 面散射峰.此时,结合导向方向1°附近出现的高斯 型导向峰,两个峰叠加将导致总的谱型仍呈现出近 高斯型但半高宽会增加,该趋势如图2(b)所示.

当微孔内部达到充放电平衡之后,出射粒子中 大部分是以镜面散射的形式出射,较少部分是以导 向方式出射.此时,0°附近的窄峰占主导地位,即 以0°附近有一尖锐窄峰,辅以1°附近较低较宽的 肩膀构型.谱型呈现出不对称趋势,由于0°附近 窄峰占主要地位,故仍对其进行半高宽统计.同时, 由于镜面散射行为相比表面以下随机碰撞来说更 加规则,其出射粒子角度分布会受微孔几何构型限 制,所以0°附近镜面散射峰半高宽约为0.4°,基本 和微孔孔道几何张角0.38°相当,如图2(d)所示.

简而言之,0°附近镜面散射峰的逐步出现将使 出射粒子位置分布谱的半高宽有所增加;而当镜面 散射峰成为主要部分时,出射粒子角度分布的半高 宽又会逐渐减小.

目前,本实验并未对不同的微孔几何构型进行 研究,而这将在我们未来的实验中开展.在此,我 们初步推测,孔径对百千电子伏离子的传输过程影 响大致如下:当孔径减小时,离子在微孔中的传输 过程会变得更加曲折,可能会经过更多次的镜面反 射后出射,这同时也要考虑在孔道后半段所建立起 的电荷斑能不能克服离子的横向动量阻止其进入 表面以下,所以在细孔的后半段可能会以表面以 下随机碰撞为主,和粗孔的传输行为有所不同.当 入射离子以+1°入射孔径大于200 nm的微孔膜时, 离子的传输轨迹很有可能是经过一次镜面反射后 沿 -1°方向出射.

5 总 结

本工作测量了100 keV 质子以+1°倾斜角入射 PC绝缘微孔膜后出射粒子角度分布、电荷态分布 以及相对穿透率随时间的演化特性. 发现微孔内 沉积的电荷可以明显提高该能量质子的穿透率和 出射电荷态纯度;但充放电平衡后出射粒子集中在 束流入射方向附近,而不是在导向方向,这一点和 keV能区的实验结果有很大不同.我们对这一特征 做出了定性的物理解释,表明100 keV质子在PC 绝缘微孔中的主要传输机理是电荷斑辅助的近表 面镜面散射行为.这一实验结果把keV至MeV能 区离子在微孔中输运现象联接起来,形成更加完整 的物理图像,即keV能区是表面以上远离表面的导 向过程; MeV 能区是深入表面以下的非弹性散射过 程; 而百千电子伏能区是电荷斑辅助下的临近表面 的镜面散射过程,这一实验结果也有助于该能区微 束的控制和应用.

参考文献

- Steinbock L J, Otto O, Chimerel C, Gornall J, Keyser U F 2010 Nano Lett. 10 2493
- [2] Létant S E, van Buuren T W, Terminello L J 2004 Nano Lett. 4 1705
- [3] Iwai Y, Ikeda T, Kojima T M, Yamazaki Y, Maeshima K, Imamoto N, Kobayashi T, Nebiki T, Narusawa T, Pokhil G P 2008 Appl. Phys. Lett. 92 023509
- [4] Martin C R 1994 Science **266** 1961
- [5] Stolterfoht N, Bremer J H, Hoffmann V, Hellhammer R, Fink D, Petrov A, Sulik B 2002 *Phys. Rev. Lett.* 88 133201
- [6] Ikeda T, Kanai Y, Kojima T M, Iwai Y, Kambara T, Yamazaki Y, Hoshino M, Nebiki T, Narusawa T 2006 *Appl. Phys. Lett.* 89 163502

- [7] Cassimi A, Ikeda T, Maunoury L, Zhou C L, Guillous S, Mery A, Lebius H, Grygiel A, C, Khemliche H, Roncin P, Merabet H, Tanis J A 2012 *Phys. Rev. A* 86 062902
- [8] Stolterfoht N, Hellhammer R, Bundesmann J, Fink D, Kanai Y, Hoshino M, Kambara T, Ikeda T, Yamazaki Y 2007 Phys. Rev. A 76 022712
- [9] Stolterfoht N, Hellhammer R, Fink D, Sulik B, Juhász
 Z, Bodewits E, Dang H M, Hoekstra R 2009 *Phys. Rev.* A 79 022901
- [10] Skog P, Zhang H Q, Schuch R 2008 *Phys. Rev. Lett.* 101 223202
- [11] Zhang H Q, Skog P, Schuch R 2010 Phys. Rev. A 82 052901
- [12] Cassimi A, Maunoury L, Muranaka T, Huber B, Dey K R, Lebius H, Lelièvre D, Ramillon J M, Been T, Ikeda T, Kanai Y, Kojima T M, Iwai Y, Yamazaki Y, Khemliche H, Bundaleski N, Roncin P 2009 Nucl. Instrum. Meth. B 267 674
- [13] Juhász Z, Sulik B, Rácz R, Biri S, J Bereczky R, Tökési K, Kövér Á, Pálinkás J, Stolterfoht N 2010 Phys. Rev. A 82 062903
- [14] Schiessl K, Tökési K, Solleder B, Lemell C, Burgdörfer J 2009 Phys. Rev. Lett. 102 163201
- [15] Milosavljević A R, Víkor G, Pešić Z D, Kolarž P, Šević D, Marinković B P, Mátéfi-Tempfli S, Mátéfi-Tempfli M, Piraux L 2007 Phys. Rev. A 75 030901
- [16] Das S, Dassanayake B S, Winkworth M, Baran J L, Stolterfoht N, Tanis J A 2007 Phys. Rev. A 76 042716
- [17] Feng D, Shao J X, Zhao L, Ji M C, Zou X R, Wang G Y, Ma Y L, Zhou W, Zhou H, Li Y, Zhou M, Chen X M 2012 Phys. Rev. A 85 064901
- [18] Hasegawa J, Jaiyen S, Polee C, Chankow N, Oguri Y 2011 J. Appl. Phys. 110 044913
- [19] Mo D 2009 Ph. D. Dissertation (Lanzhou: Institute of Moden Physice. Chiese Academy of Sciences) (in Chinese) [莫丹 2009 博士学位论文(兰州: 中国科学院近代物 理研究所)]
- [20] Stolterfoht N, Hellhammer R, Sulik B, Juhász Z, Bayer V, Trautmann C, Bodewits E, Hoekstra R 2011 Phys. Rev. A 83 062901

Dynamic evolution of 100-keV H⁺ through polycarbonate nanocapillaries^{*}

Zhou Wang Niu Shu-Tong Yan Xue-Wen Bai Xiong-Fei Han Cheng-Zhi Zhang Mei-Xiao Zhou Li-Hua Yang Ai-Xiang Pan Peng Shao Jian-Xiong[†] Chen Xi-Meng[‡]

(School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China) (Received 17 January 2016; revised manuscript received 7 March 2016)

Abstract

In recent years, the guiding effect of highly charged ions (HCIs) through insulating nanocapillary membrane has received extensive attention. It is found that slow highly charged ions at keV energies can be guided along the capillary even when the title angle of membrane is a few degrees and larger than geometry opening angle of the capillary. Initially, Stolterfoht et al. (2002 Phys. Rev. Lett. 88 133201), according to the incident ions deposit positive charges on the capillary surface in a self-organizing manner, proposed scattering and guiding regions to explain this guiding phenomenon. Hereafter, a detailed experiment and simulation performed by Skog et al. (2008 Phys. Rev. Lett. 101 223202) provided clear evidence that the guiding process is actually attributed to the self-organized charge patches formed on the inner capillary walls. HCIs entering into a capillary may hit the surface, leaving their charge on the inner wall of the capillary. When the capillary axis is tilted with respect to the beam incidence direction, a charge patch is formed in the capillary entrance, simultaneously a repulsive electric field is created. After sufficient charge deposition this field is strong enough to deflect the subsequent ions in the direction of the capillary exit. Therefore, the ions are guided through the capillary. The deflection at the charge patch only occurs at relatively large distances from the capillary wall so that the incident charge state of the ions is kept during the passage through the capillary. Further experimental and theoretical studies on various target materials, such as polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC), SiO₂, and Al₂O₃ indeed found that a single or a small number of charge patches near the entrance formed in the charge up process dominate the observed oscillatory variations of the ion emission angle and the final guiding process. Besides, measurements and simulations of the steering of swift ions at MeV energies have shown that the transmission mechanism of the high energy ions in a tapered tube is primarily dominated by multiple random inelastic collisions below the surface and the charge patches are not responsible for the transmission process. However, the studies of the transmission of hundreds keV ions through nanocapillaries are still lacking so far. In this work, we observe the evolution of the angular distribution, charge state distribution, FWHM and transmission rate of 100 keV H⁺ ions incident on a polycarbonate (PC) membrane at $+1^{\circ}$ tilt angle. It is found that the transmitted particles are located around the direction along the incident beam, not along the capillary axis, which suggests that the mechanism of hundreds keV $(E/q \sim 100 \text{ kV})$ protons through capillaries is significantly different from that for the guiding effect of keV protons. We present a qualitative explanation based on the data: that the 100 keV $\rm H^+$ are transmitted by multiple random inelastic collisions below the surface is attributed to the absence of the deposited charges on the surface of the capillary at the beginning of the experiment. After the equilibrium, several charge patches are formed on the inner wall of the capillary, which suppresses the ions to penetrate into the surface of the capillary, while the H⁺ is transmitted via specular scattering above the surface (or closest to the surface) assisted by the charge patches, and finally is emitted in the incident direction through twice specular scattering. This finding increases the knowledge of charged ions through nanocapillaries, which is conducible to the applications of nanosized beams produced by capillaries or tapered glass within hundreds keV energies in many scientific fields.

Keywords: nanocapillary membrane, charge patch, surface scattering

PACS: 34.50.-s, 79.20.Rf, 68.49.Sf

DOI: 10.7498/aps.65.103401

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11174116, 11175075).

[†] Corresponding author. E-mail: shaojx@lzu.edu.cn

[‡] Corresponding author. E-mail: chenxm@lzu.edu.cn